

MRS 導體阻抗量測系統



產品用途

- 本微電阻量測系統，是將試件置於急速溫度變化的狀態下，進行試件的微電阻變化量測，如印刷電路板通孔、球格式封裝 (Ball Grid Array ,BGA) 、軟性印刷電路板(Flex Printed Circuit ,FPC) 、異方性導電膠 (Anisotropic Conductive Film ,ACF) 、等不同試件，進行「高速多通道微電阻變化連續測量」，評估電子元件與特殊複合導電材料接合部的可靠度與正確性。
- 待測物(DUT)的導電狀態，可透過本公司開發設計微電阻測量系統，進行相關試驗規範條件量測，人性化的操作介面、微歐姆曲線分析、高低溫曲線值、溫度循環數，皆可經由此軟體做輕而易舉的判定與分析。
- 本系統滿足 IPC、JEDEC、EIAJ、GB..等國際與國家級規範標準。

產品特色

- 電阻量測解析度:1 $\mu\Omega$ 。
- 進口耐高低溫量測排線使用壽命長、焊接於試件時(Devices under Test, DUT) 時簡易。
- 量測範圍廣：10⁻³~10⁶ 歐姆(Ω)，高精準 10m Ω 測定值 \pm 5%以內。
- 高擴充功能：標準配置 30ch，最大可擴充至 180ch。
- 符合國際標準之量測儀表，使用 4 線量測設計(ISO/IEC 17025) 。
- 高加速量測速度：高精度 22 位元 A/D 轉換提供高穩定性。